# 06.4;08.3;13.1 Проявление квантового размерного эффекта в поликристаллическом графене при сверхвысоких давлениях

© Д.А. Прохоров<sup>1,2</sup>, С.М. Зуев<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Государственный научный центр РФ Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, Москва, Россия

<sup>2</sup> МИРЭА — Российский технологический университет, Москва, Россия E-mail: prohorovdmitrii97@yandex.ru, sergei\_zuev@mail.ru

Поступило в Редакцию 28 мая 2024 г. В окончательной редакции 17 июля 2024 г. Принято к публикации 29 июля 2024 г.

> Исследовано проявление квантового размерного эффекта в поликристаллическом порошкообразном графене (Gf), изготовленном методом механического расслоения графита в воде с дальнейшим высушиванием, при различных давлениях прессования (вплоть до 0.4 GPa). Проявление квантового размерного эффекта заключалось в скачкообразном увеличении тепло- и температуропроводности, измеренных методом вспышки и методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Бесконтактное измерение рельефа поверхности Gf осуществлялось методом оптической профилометрии.

> Ключевые слова: квантовый размерный эффект, двумерная аллотропная модификация углерода, поликристаллический графен, сверхвысокие давления.

DOI: 10.61011/PJTF.2024.22.59135.20003

В процессе исследования проявления квантового размерного эффекта (КРЭ) в графене в качестве исходного материала использовался поликристаллический графен в форме порошка (Gf), изготовленный методом механического расслоения графита в воде с дальнейшим высушиванием. Первое в мире экспериментальное проявление КРЭ было продемонстрировано Луцким с соавторами в 1965 г. в тонких пленках висмута [1].

В настоящей работе исследована зависимость теплофизических свойств (коэффициента тепло- и температуропроводности) образцов Gf от давления прессования, а также проведено сравнение полученных после их прессования поверхностей (в отличие от оригинальной работы Xiong с соавторами [2], в которой исследовался термоинтерфейс на основе листов углеродного нановолокна с поливиниловым спиртом  $C_2H_4O$ ). Также были проведены измерения, позволившие установить взаимосвязь давления прессования Gf с шероховатостью поверхности.

Сжатие образцов Gf до толщины h производилось при сверхвысоких давлениях (до 0.4 GPa) холодным сухим прессованием на вулканизационном прессе с гидравлическим приводом ИП-1000. Превращение графита в алмаз осуществляется статическими и динамическими методами [3]. Статический синтез проводят в области фазовой диаграммы углерода, где алмаз термодинамически более устойчив, чем графит (используется каталитический метод при давлении от 4 до 10 GPa и температурах от 1000 до 2500 K). В качестве динамического метода используется ударно-волновое сжатие, создаваемое взрывчатыми веществами при давлении 30 GPa и температурах от 1000 до 3000 K. В исследуемом диапазоне давлений прессования и температур (вплоть до +150°C) превращения в алмаз не происходит.

Измерение шероховатости и рельефа поверхности образцов Gf проводилось двумя бесконтактными методами: методом оптической профилометрии и методом фазосдвигающей интерферометрии (PSI). Определение коэффициента температуропроводности выполнялось методом вспышки (LFA), в котором возрастание температуры образца (вплоть до +150°C) измеряется в зависимости от времени с помощью инфракрасного детектора Cd-Hg-Te. Для получения дифрактограмм применялся рентгенодифрактометрический метод.

Известно, что сверхвысокие давления воздействуют на межатомные расстояния в кристаллической решетке. Взаимосвязь параметра Грюнайзена  $\gamma$  с коэффициентом теплопроводности  $\chi$  описывается формулой Лейбфрида-Шлемана [4]:

$$\chi = \frac{3}{10\pi^3} \frac{k_{\rm B}^3 M a}{\hbar^3 \gamma^2} \frac{\Theta_{\rm D}^3}{T},\tag{1}$$

где  $\chi$  — коэффициент теплопроводности [W/(m · K)],  $\Theta_{\rm D}$  — температура Дебая [K],  $k_{\rm B}$  — постоянная Больцмана (1.381 · 10<sup>-23</sup> J/K), M — молекулярный вес [kg],  $\hbar$  — постоянная Планка (6.626 · 10<sup>-34</sup> J · s), a — параметр кристаллической решетки [m], T — температура [K].

Величину χ в случае гомогенных систем также можно вычислить по следующей формуле:

$$\chi(T) = \alpha(T)\rho(T)C_p(T).$$
(2)

Здесь  $\rho$  — плотность образца [kg/m<sup>3</sup>],  $\alpha$  — коэффициент температуропроводности [m<sup>2</sup>/s],  $C_p$  — удельная тепло-емкость при постоянном давлении [J/(kg · K)].



**Рис. 1.** Изображения поверхности спрессованного при давлении 20.0 МРа образца Gf. *а* — морфология поверхности; *b* — фазовое изображение с выделенным участком отслоения в неразвернутом виде; *с* — профиль поверхности вдоль линии, изображенной на части *b*.

Исходя из дифрактограмм можно приближенно оценить размеры кристаллитов образцов Gf по формуле Шеррера [3]:

$$d = \frac{K\lambda}{\beta\cos\theta},\tag{3}$$

где d — средний размер областей когерентного рассеяния кристаллитов [nm], K — коэффициент формы частицы образца,  $\lambda$  — длина волны рентгеновского излучения [nm],  $\beta$  — ширина рефлекса на полувысоте [deg],  $\theta$  — угол дифракции [deg].

Первоначально исходя из полученных методом сканирующей электронной микроскопии изображений поверхностей исследуемых спрессованных образцов (рис. 1, a) выявлялись слоистые участки (рис. 1, b), на которых оценивалась толщина многослойного графена методом PSI при исследовании фазовых изображений (рис. 1, c). Высота отслоившегося участка составила около 90 nm, причем аналогичная высота была определена и на других участках образца. При получении дифрактограмм исследуемых образцов со стороны рентгеновской трубки устанавливались щель Соллера и экваториальная щель 0.5 mm, а со стороны детектора — щель Соллера, экваториальная щель 0.05 mm и никелевый β-фильтр.

Измерение коэффициента температуропроводности  $\alpha$  образцов проводилось методом LFA при различных температурах. Фактор анизотропии физических свойств не рассматривался по причине хаотичного расположения исходных частиц и трудности их последующей ориентации при прессовании. В отличие от методов горячей охранной зоны, греющих плит или термостимулированного тока метод LFA позволяет проводить измерения температуропроводности образца в области наибольших значений (до 1000 mm<sup>2</sup>/s) [5]. Удельная теплоемкость  $C_p$  определялась методом дифференциальной сканирующей калориметрии.

Шероховатость поверхности исследуемых образцов определялась такими параметрами, как среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений поверхности от базовой плоскости  $(R_a)$ , среднеквадратичное значение высот поверхности  $(R_q)$ , средняя максимальная высота профиля (среднее значение из десяти максимумов и десяти минимумов поверхности)  $(R_z)$  и максимальная высота поверхности (расстояние между мак-

симумом и минимумом поверхности) ( $R_t$ ). Плотность образцов  $\rho$  находилась после предварительного термостатирования при необходимой температуре в вакууме путем прямых измерений геометрических размеров и массы. Прессование образцов Gf производилось путем однократного воздействия, что неизбежно приводило к уплотнению слоев, изменениям размеров кристаллитов и параметра Грюнайзена  $\gamma$ , а следовательно, и к изменению  $\chi$  (см. (1)). Измерения  $\alpha$  проводились после термостатирования образцов в течение 60 min при постоянной температуре +25, +100 и +150°С. Коэффициент теплопроводности  $\chi$  был получен расчетным методом по формуле (2).

Методом PSI можно не только оценить количество слоев Gf, как было показано на рис. 1, но и подтвердить его поликристаллическую структуру. Также в ходе экспериментов было определено, что образцы прозрачны в ближней ИК-области, что указывает на высокий показатель теплопроводности данного материала. В табл. 1 приведены результаты расчетов по дифрактограммам образцов Gf. Для образцов наблюдаются пики вблизи 26.55 и 54.69°, отвечающие фазам графита с ориентациями (002) [7] и (004). Пики в областях от 23 до 25° и от 42 до 45° могут соответствовать как фазе графита,

Таблица 1. Результаты расчетов по дифрактограммам исследуемых образцов Gf

p, MPa	K	λ, nm	$2\theta$ , deg	$\beta$ , deg	d, nm
0.1	0.94	1.5406	$egin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	0.3014	28.27
200.0	0.94	1.5406		0.1574	54.16

Примечание.  $\Delta_{\theta}$  абсолютная погрешность измерения угла дифракции (0.01%) [6].

так и фазе графена. Исходя из более ранних исследований дифрактограмм графена [8-10] можно сделать вывод, что дифрактограмма образцов Gf соответствует дифрактограмме графита, но нельзя с уверенностью говорить об отсутствии в нем графена. На стадии приложения давления р происходит укладка частиц, нарастание их контактов друг с другом, удаление воздуха, интенсивное перемещение частиц в направлении приложения усилия (в меньшей степени в поперечном направлении). Поры заполняются, и частицы занимают устойчивое положение. В результате увеличения суммарной контактной поверхности частицы приобретают механическое сцепление. С дальнейшим увеличением р рост плотности происходит из-за упругой деформации частиц в области контактов. При прессовании в этот момент времени образец сохраняет исходный размер кристаллитов. При достижении p = 200 МРа происходит хрупкое разрушение (пластическое течение материала): нагрузка превышает сопротивление кристаллитов сжатию, и они деформируются. В результате этого кристаллиты перераспределяются и, как видно из табл. 1, обладают большим размером (почти в 2 раза). Горячее прессование в еще большей степени способствует росту кристаллитов, а значит, и увеличению  $\chi$ . Полученные зависимости χ и α от давления прессования р несвойственны графиту. Осцилляции  $\chi$  и  $\alpha$ , пик которых приходится на р около 44 МРа, демонстрируют аналогию с осцилляциями других физических свойств в тонких пленках висмута (толщиной от 20 до 160 nm). Все измеренные теплофизические свойства образцов Gf представлены в табл. 2. Исходя из измерений при p = 400 MPa, демонстрирующих увеличение α и χ при уменьшении температуры, можно предположить, что для Gf в области криогенных температур будет происходить аналогичный рост амплитуды физических свойств. Для спрессованных

Таблица 2. Результаты измерения физических свойств исследуемых образцов Gf

p, MPa	ho, kg/m <sup>3</sup>	$10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$	χ, W/(m·K)	h, mm	<i>T</i> , °C	$C_p$ , J/(kg·K)
0.1	475	$0.35\pm\delta_lpha$	$0.1\pm\delta_\chi$	2.70	+100	$602\pm\delta_C$
1.0	475	$0.34\pm\delta_lpha$	$0.1\pm\delta_\chi$	3.11		$619\pm\delta_C$
2.3	1590	$0.79\pm\delta_lpha$	$1.0\pm\delta_\chi$	2.11		$796 \pm \delta_C$
20.0	2213	$7.38\pm\delta_{lpha}$	$16.3 \pm \delta_{\chi}$	1.11		$998 \pm \delta_C$
44.1	1690 1851	$egin{array}{l} 42.23\pm\delta_lpha\ 42.61\pm\delta_lpha \end{array}$	$58.7\pm\delta_{\chi}\ 59.0\pm\delta_{\chi}$	1.90 2.25		$egin{array}{l} 823\pm\delta_C\ 748\pm\delta_C \end{array}$
200.0	1810	$6.27\pm\delta_lpha$	$10.3\pm\delta_\chi$	1.79		$908\pm\delta_C$
300.0	1729	$5.85\pm\delta_lpha$	$11.6 \pm \delta_{\chi}$	0.48		$1147 \pm \delta_C$
400.0	2587	$egin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	$egin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	0.26	+25 +100 +150	$egin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$

Примечание.  $\delta_{\alpha}$  — относительная погрешность измерения  $\alpha$  (3%) [11],  $\delta_{C}$  — относительная погрешность измерения  $C_{p}$  (1%) [12],  $\delta_{\chi}$  – относительная погрешность измерения  $\chi$  (4%) [11,12], рассчитанная исходя из суммарной погрешности по формуле (2) при пренебрежимо малой погрешности измерения  $\rho$ .



**Рис. 2.** Шероховатость поверхности образцов Gf, спрессованных при p = 20.0 (*a*), 44.1 (*b*) и 400.0 MPa (c). Увеличение 51.1×.

образцов Gf, двумерные изображения рельефа которых представлены при различных давлениях прессования на рис. 2, обнаружено отсутствие зависимости шероховатости поверхности от давления прессования. Факторами, определяющими шероховатость поверхности образца в таком случае, являются исходный средний размер частиц порошка и шероховатость внутренней поверхности применяемой пресс-формы. Применение КРЭ в Gf позволяет на несколько порядков увеличивать теплои температуропроводность, что обусловливает целесообразность его использования в задачах охлаждения электронно-компонентной базы современных устройств. К факторам, ограничивающим применение Gf, относятся проблемы в изготовлении из него сложных по форме конструкций, требующих специальных пресс-форм, и то, что он является хорошим проводником электрического тока

### Благодарности

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования РТУ МИРЭА.

#### Финансирование работы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-29-00079 (https://rscf.ru/project/23-29-00079).

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] В.Н. Луцкий, В.Б. Сандомирский, Ю.Ф. Огрин, И.М. Лифшиц, А.М. Косевич, Явление осцилляций термодинамических и кинетических свойств пленок твердых тел, государственный реестр открытий СССР, № 182, приоритет от 21 мая 1953 г. (теоретическое обоснование) и 10 декабря 1965 г. (экспериментальное доказательство).
- [2] J. Xiong, S. Chen, Y. Choi, K. Matsugi, Sci. Rep., 11, 17183 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-96691-z
- [3] В.В. Прут, Численный расчет перехода графита в алмаз в металлическом Z-пинче (РНЦ "Курчатовский институт", М., 2007), с. 1.
- [4] Ш.М. Исмаилов, С.М. Оракова, З.А. Исаев, Х.Ш. Яхьяева, TBT, **59** (1), 51 (2021). DOI: 10.31857/S0040364421010051 [Sh.M. Ismailov, S.M. Orakova, Z.A. Isaev, Kh.Sh. Yakh'yaeva, High Temp., **59** (1), 46 (2021). DOI: 10.1134/S0018151X21010053].
- [5] И.М. Абдулагатов, Б.А. Григорьев, З.З. Абдулагатова, С.Н. Каллаев, А.Г. Бакмаев, З.М. Омаров, Вести газовой науки, № 1 (46), 129 (2021).

- [6] Дифрактометры: рентгеновские модели ДРОН-8Н и ДРОН-8Т, свидетельство об утверждении типа средств измерений № 82575-21 (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 2023).
- J. Fayos, J. Solid State Chem., 148 (2), 278 (1999).
   DOI: 10.1006/JSSC.1999.8448
- [8] R. Siburian, H. Sihotang, S. Lumban Raja, M. Supeno, C. Simanjuntak, Orient. J. Chem., 34 (1), 182 (2018). DOI: 10.13005/ojc/340120
- [9] T.F. Emiru, D.W. Ayele, Egypt. J. Basic Appl. Sci., 4 (1), 74 (2017). DOI: 10.1016/j.ejbas.2016.11.002
- [10] A. Ahmad, S. Ullah, A. Khan, W. Ahmad, A.U. Khan, U.A. Khan, A.U. Rahman, Q. Yuan, Appl. Nanosci., 10 (4), 1243 (2020). DOI: 10.1007/s13204-019-01204-0
- [11] Light-Flash-Apparatur LFA 467 HyperFlash-Serie: Methode, Technik, Applikationen zu Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit, Netzsch, 0823. https://analyzingtesting.netzsch.com/\_Resources/Persistent/6/f/4/1/ 6f41f20a04ff124384a8963ed7bf4184c25e1c40/LFA\_467 \_HyperFlash\_de\_web.pdf
- [12] DSC 204 F1 Phoenix, Technical Specifications, Netzsch, 0222. https://analyzing-testing.netzsch.com/\_Resources/Persistent/ b/8/6/c/b86c2a6637064b1361d580c2bc05367072b194d6/Key
  - \_Technical\_Data\_en\_DSC\_204\_F1\_Phoenix.pdf